



S/N Label, placed over the debug hole.

Konstr/Drawn L. WASE	Datum/Date 2010-08-31	Kontr/Check TOBO	Material Material <not specified>	
Ändrad av/Modified by L. WASE	Ändrad/Modified 2010-08-31	Ytjämnhet/Roughness Ra μm	Ytbehandling/Surface treatment	
Där ej annat anges/Unless otherwise stated Gen tol ISO 2768-mK Utdrag ur/Excerpt from ISO 2768-m	Benämning/Denomination Label Kit Overview		Skala/Scale 1:1	Blad/Sheet 1(1)
0,5-6 ±0,1 Hålkälsradier (6)-30 ±0,2 Fillet radii (30)-120 ±0,3 (120)-400 ±0,5 Kanter brutna (400)-1000 ±0,8 Edges broken			Art.No.	Size A4
			Ritn nr/Drawing No T197929	Rev A